

## СПЕКТРАЛЬНАЯ ФОРМА КОНТУРА УСИЛЕНИЯ ИНЖЕКЦИОННЫХ ЛАЗЕРОВ НА ДВОЙНОЙ ГЕТЕРОСТРУКТУРЕ AlGaAs С НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ АКТИВНОЙ ОБЛАСТЬЮ

Ю.Л. Бессонов, В.Н. Морозов, Чан Минь Тхай, В.Р. Шидловский

УДК 621.373.8.038.825.4

Исследована спектральная форма линии усиления инжекционных гетеролазеров с узким полосковым контактом и низколегированной активной областью.

При определении ширины спектра излучения в стационарном режиме генерации и при СВЧ модуляции планарных полосковых гетеролазеров необходимо знать спектральную форму линии усиления на пороге генерации /1, 2/. Легирование активной области акцепторами приводит к существенному изменению спектрального профиля коэффициента усиления /3/. Имеется ряд экспериментальных результатов по исследованию спектра усиления в ДГС-AlGaAs лазерах с легированием активной области акцепторами до концентрации  $p = 10^{18} \text{ см}^{-3}$  /4, 5/. Интересно также исследование спектра усиления при низком уровне легирования активной области, так как это должно привести к сужению спектра усиления /3/ и, следовательно, к сужению спектра излучения лазера /1, 2/. В данной работе приводятся экспериментальные результаты по исследованию спектрального профиля усиления в планарных полосковых гетеролазерах на AlGaAs с шириной полоскового контакта 5 мкм и уровнем легирования активной области  $p = 5 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$ . Все лазеры работали в непрерывном режиме генерации при комнатной температуре, плотность порогового тока составляла  $6,7 \text{ кA}/\text{см}^2$ , длина резонатора лазеров – 160 мкм.

Для определения спектральной зависимости усиления использовался метод, основанный на измерении мощности излучения на mode резонатора лазера и в соседнем минимуме в спектре суперлюминесценции /6/. Спектр усиления рассчитывался из экспериментальных данных согласно

$$g(\omega_r) = a + \frac{1}{\Gamma L} \left( \frac{1}{2} \ln \frac{1}{R_1 R_2} + \ln \frac{\sqrt{\Gamma^+} - \sqrt{\Gamma^-}}{\sqrt{\Gamma^+} + \sqrt{\Gamma^-}} \right), \quad (1)$$

где  $\omega_r$  – резонансная частота;  $a$  – внутренние потери излучения в активной

области;  $\Gamma$  — фактор оптического ограничения;  $L$  — длина резонатора;  $R_1, R_2$  — коэффициенты отражения от граней резонатора;  $I^+$  — мощность излучения на частоте  $\omega_r$ ;  $I^-$  — мощность в соседнем минимуме. Для расчета  $g(\omega_r)$  использовались следующие значения:  $a = 35 \text{ см}^{-1}$ ,  $\Gamma = 0,35$ ,  $R_1 = R_2 = 0,3$ ,  $L = 160 \text{ мкм}$ . Спектры излучения регистрировались дифракционным спектрометром ДФС-12 с разрешением  $0.5 \text{ \AA}$ .

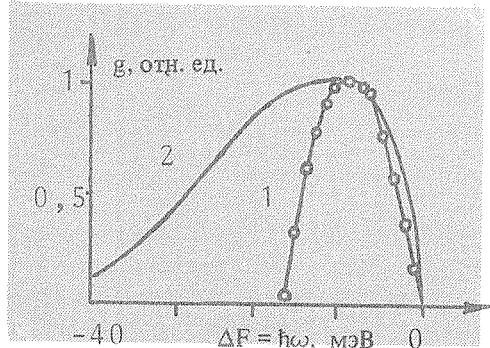


Рис. 1. Спектральная зависимость усиления  $g$  при  $p = 5 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$ ,  $J = 6,7 \text{ kA/cm}^2$  (1) и  $p = 10^{18} \text{ см}^{-3}$ ,  $J = 6,4 \text{ kA/cm}^2$  (2).

Результаты экспериментального исследования спектра усиления на пороге генерации представлены на рис. 1: кривая 1 — экспериментальные результаты для наших образцов, 2 — результаты, полученные в [4] для активной области с  $p = 10^{18} \text{ см}^{-3}$ .

Таблица 1

Результаты исследования спектров усиления

№ образца	Ширина спектра усиления, мэВ	Кривизна спектральной зависимости усиления, $\text{эВ}^2 \text{ см}^{-1}$		$g_{\max}, \text{см}^{-1}$	$\Delta = \frac{g_0 - g_1}{g_0}$
		справа	слева		
47	11	$5 \cdot 10^6$	$2,8 \cdot 10^6$	102	$7,2 \cdot 10^{-3}$
52	10	$4,9 \cdot 10^6$	$1,9 \cdot 10^6$	100	$3,6 \cdot 10^{-3}$
57	10	$5,2 \cdot 10^6$	$1,8 \cdot 10^6$	96	$8,3 \cdot 10^{-3}$
60	11	$9 \cdot 10^6$	$4,1 \cdot 10^6$	110	$7,2 \cdot 10^{-2}$

Нами оценены возможные ошибки в определении усиления по формуле (1), которые могут возникнуть в связи с неточным определением значений  $a$  и  $\Gamma$ . Вариации коэффициентов  $a$  и  $\Gamma$  в диапазоне соответственно  $25 \div 40$  и  $0,3 \div 0,4 \text{ см}^{-1}$  влияют только на максимальное значение усиления, а ширина спектра усиления меняется при этом не более чем на 1 мэВ.

В табл. 1 представлены ширина спектра излучения на пороге генерации  $\Delta\omega$ , значение коэффициента усиления в максимуме  $E_{\max}$ , относительный дефицит усиления в соседней с основной продольной mode  $\Delta$ , а также кривизна контура усиления справа и слева вблизи вершины. Для сравнения укажем, что при использовании в качестве активного слоя GaAs с концентрацией акцепторов  $p = 10^{18} \text{ см}^{-3}$  дефициты усиления составляют  $(0,9 \div 2) \cdot 10^{-4}$  при таких же, как и в нашем случае, плотностях тока инжекции /4, 5/. Уширение спектра усиления связано, по всей видимости, с увеличением коэффициента усиления на акцепторном уровне при увеличении концентрации примеси /3/.

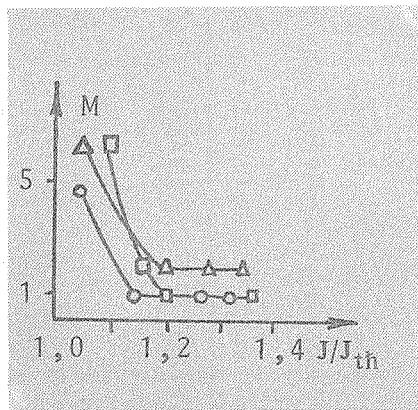


Рис. 2. Зависимость числа мод  $M$  в спектре излучения от тока накачки для различных образцов.

Таким образом, для сужения спектра усиления и, следовательно, спектра излучения может оказаться удобнее использовать низколегированную активную область. На рис. 2 представлены зависимости числа продольных мод в спектре излучения от относительного превышения тока накачки над пороговым  $J_{th}$  (все образцы работали на одной поперечной mode). Лазеры работали, как правило, в стационарном режиме генерации, но отдельные образцы обладали самопроизвольными пульсациями излучения. Однако во всех случаях мы наблюдали достаточно узкий спектр, который при отсутствии пульсаций становился одночастотным.

Важно отметить, что в литературе практически отсутствуют данные по детальному исследованию влияния уровня легирования активной области на характеристики полосковых гетеролазеров с узким контактом. Наши результаты показывают, что изменение уровня легирования активной области позволяет управлять шириной спектра излучения таких лазеров.

Поступила в редакцию 1 октября 1984 г.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Бессонов Ю.Л. и др. Квантовая электроника, 12, № 2, 347 (1985).
2. Морозов В.Н. Квантовая электроника, 1, 634 (1974).
3. Александров А.Г., Полузектов И.А., Попов Ю.М. В сб. Квантовая электроника, под ред. Н.Г. Басова, № 3, 15 (1971).
4. Голдобин И.С. и др. Квантовая электроника, 10, 598 (1983).
5. Елисеев П.Г., Чан Минь Тхай. Квантовая электроника, 1, 1138 (1974).
6. Hakk i B.W., Paoli T.L. J. Appl. Phys., 44, 4113 (1973).